



エネルギー分散型
軽元素 蛍光X線分析装置
/Vega

- 軽元素、希土類元素の
分析アプリケーション使用
- 優れた非破壊元素分析
- イスラエル Xnemetrix製

<特長>

- 非破壊元素分析（元素分析 Na(11)–U(92) 軽元素, ppm-100%）
- シリコドリフト検出器（高計算率アプリケーションにより低元素／高元素 両対応）
- 超薄型ウィンドウを備えたSDD LE（軽元素分析を促進）
- 8つのチューブフィルター、二次ターゲット

<きめ細かな使いやすさ>

- ◎高速かつ高精度な定量分析
- ◎SDD LEにより、低ノイズ、高カウントの中で、より高いエネルギー分解と迅速な結果の検出が可能
- ◎優れたピーク/バックグラウンド比で検出器の応答性を向上

<仕様>

品番	OSK 083NY700
検出器	超薄型ウィンドウを備えたシリコドリフト (-125eV)
測定元素範囲	Na(11) - U(92)、軽元素
検出率	サブ ppm-100%
励起	60kV、400W X線装置（Rhアノード付／Mo,W,Pd,Agオプション）
励起タイプ	二次ターゲットおよびフィルター直接方式
オートサンプラー	10/20 ポジション
本体重量	約110kg
試験室寸法	直径28cm、高さ6cm
チューブフィルター	8種類より選択可
セカンダリーターゲット	8種類より選択可
コリメーター（視準器）	0.3mm - 3mm
作業環境	エア／ヘリウム／真空
電源	100-230VAC 50/60Hz
ハードウェア	PC内蔵型
ソフトウェア	解析パッケージ（表示言語:英語 Windows OS対応）
オプションソフトウェア	高FP解析、規格外ソフトウェア、ライブラリー

<オプション>

サンプルスピナー



OSK オガワ精機株式会社

[高田馬場支店]
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jpn.org